

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62586-2
Edition 1.0 2013-12

POWER QUALITY MEASUREMENT IN POWER
SUPPLY SYSTEMS –

Part 2: Functional tests and uncertainty
requirements

IEC 62586-2
Édition 1.0 2013-12

MESURE DE LA QUALITE DE L'ALIMENTATION
DANS LES RESEAUX D'ALIMENTATION –

Partie 2: Essais fonctionnels et exigences
d'incertitude

CORRIGENDUM 1

**Table 3 – Testing points for each
measured parameter**

*Replace, in the row "Dips/Interruptions"
and column "Testing point P1", for classes
A and S, "Threshold dip-" by "Threshold
dip+."*

*Replace, in the row "Dips/Interruptions"
and column "Testing point P2", for class A
and class S, "Threshold dip+" by
"Threshold dip-."*

6.4.1 General

*In the existing table, in the row "A4.1.4"
and column "Testing points according to
Table 3", replace "P2 for Dips/Int." by "P3
for Dips/Int."*

6.6.1 Measurement method

*In the table, in the row "A6.1.6" and
column "Target of the test", replace the
existing text by:*

"Check that a properly designed anti-aliasing filter is used on the device, providing (in combination with oversampling) an attenuation exceeding 50 dB for any frequency producing an alias below or up to the 50th harmonic."

7.12.3 Influence of temperature

In the table, in all the rows of the column

**Tableau 3 – Points d'essais pour
chaque paramètre mesuré**

*Remplacer, dans la ligne "Creux,
interruptions" et la colonne "Point d'essai
P1", pour la classe A et classe S, "Creux-
seuil" par "Creux+ seuil".*

*Remplacer, dans la ligne "Creux,
interruptions" et la colonne "Point d'essai
P2", pour la classe A et classe S, "Creux+
seuil" par "Creux- seuil".*

6.4.1 Généralités

*Dans le tableau existant, dans la ligne
"A4.1.4" et la colonne "Points d'essai
selon le Tableau 3", remplacer "P2 pour
les Creux/Int." par "P3 pour les Creux/Int."*

6.6.1 Méthode de mesure

*Dans le tableau, dans la ligne "A6.1.6" et
la colonne "Cible de l'essai", remplacer le
texte existant par:*

"Vérifiez qu'un filtre anti-repliement correctement conçu est utilisé sur l'appareil, en fournissant (en combinaison avec suréchantillonnage) une atténuation dépassant 50 dB de toutes les fréquences produisant un alias au-dessous ou jusqu'à la 50ème harmonique."

7.12.3 Influence de la température

Dans le tableau, dans toutes les lignes de